

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200



میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 ساخت شرکت Jeol کشور ژاپن می باشد. میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 برای طیف وسیعی از زمینه ها مانند فناوری نانو، فلزات، نیمه هادی ها، سرامیک، پزشکی و زیست شناسی استفاده می شود. علاوه بر این، برنامه های کاربردی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM در حال گسترش هستند تا نه تنها تحقیقات پایه ای را پوشش دهند، بلکه کنترل کیفیت تولیدات را نیز انجام دهند. براساس سابقه بسیار موفق میکروسکوپ های الکترون روبشی SEM سری InTouchScope شرکت Jeol، میکروسکوپ الکترون روبشی SEM سری JSM-IT200 برای رفع تقاضای روزافزون در بازار ارائه می شود.

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 دارای عملکرد نوآورانه است که با سری های JSM-IT500 که مدل های بالاتر از InTouchScope می باشد قابل مقایسه است. از لحاظ توان پردازش، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 حدود 35٪ کارایی بالاتری از سری قبلی میکروسکوپ الکترونی SEM مدل JSM-IT100 دارد. میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 آنالیز را به طور قابل توجهی سریع تر و آسان تر انجام می دهد. با این وجود، تقاضا برای دستیابی سریعتر و آسانتر داده ها از تصاویر SEM و نتایج آنالیز، مانند اسپکتروسکوپی پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDS)، افزایش می یابد. میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 با کارایی بالای خود، راندمان بالایی را ارائه می دهد.

ویژگی های اصلی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200

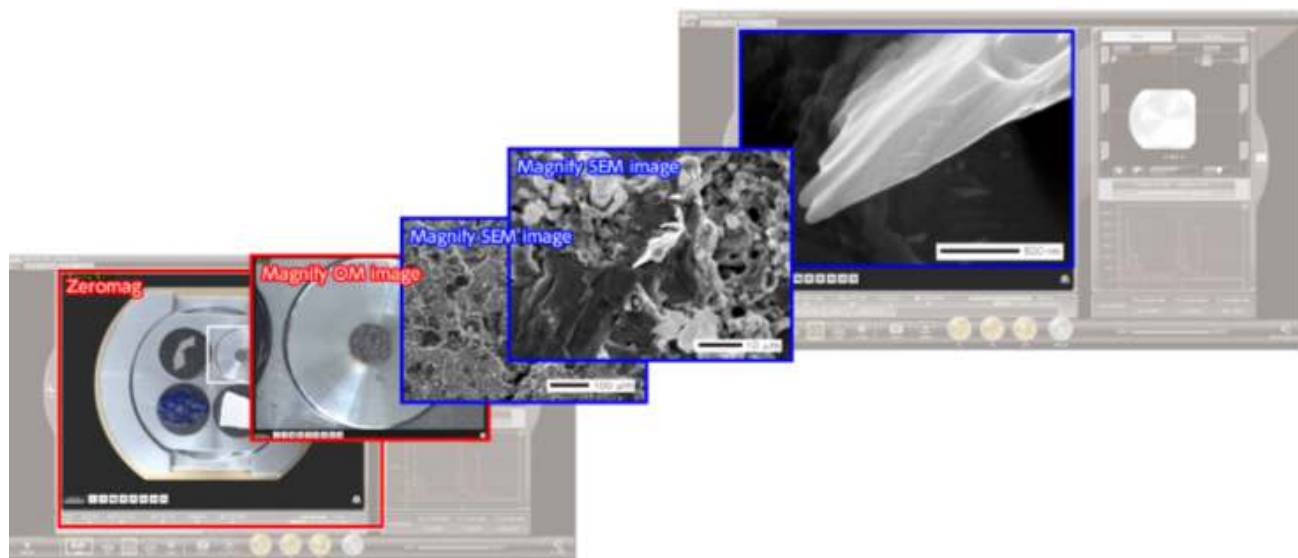
- میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 دارای ویژگی تعویض جهت یابی نمونه، عملکرد آغاز کاربر پسند، عملیات هدایت را از بارگیری نمونه به جستجوی منطقه ارائه می دهد، همچنین ارائه دهنده تصویر SEM می باشد.
- "Zeromag" برای انتقال از اپتیک به تصویر برداری SEM، "آنالیز لحظه ای" برای نمایش نتایج آنالیز عناصر در زمان واقعی، SMILE VIEW برای تولید گزارش بدون وقفه از مشاهدات و / یا نتایج تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه، آنالیز سریع با انتقال یکپارچه از OM به SEM استفاده می شود.
- تعویض نمونه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200: هدایت عملکرد از تشخیص نمونه تا مشاهده آن در میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 انجام می شود.

راهنمای گام به گام برای تبادل نمونه، تنظیم وضعیت و تصویربرداری خودکار توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 صورت می گیرد.



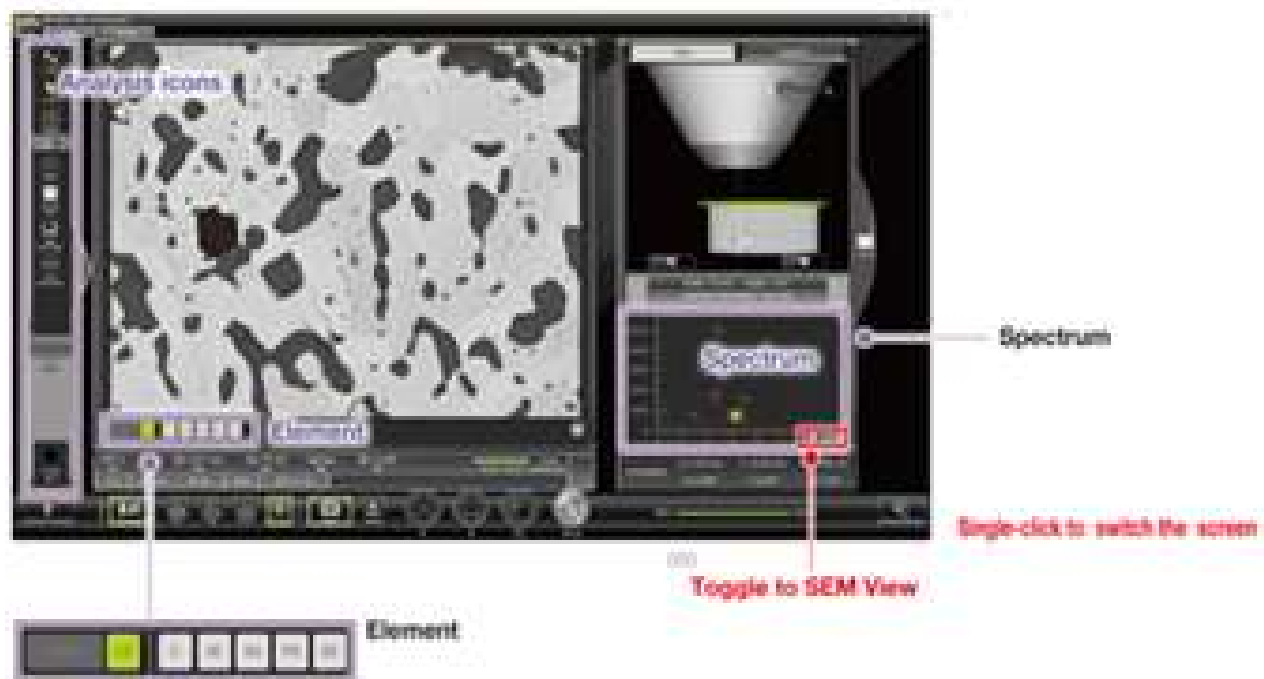
مشاهده سریع "Zeromag" در میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200

کاربران میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 می توانند منطقه نمونه را پیدا کرده یا موقعیت های آنالیز را با Holder Graphics یا تصویر CCD نوری نمایش داده شده در صفحه اصلی مشخص کنند.



تصویر Zeromag نمایش داده شده در صفحه اصلی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200

در آنالیز سریع "آنالیز لحظه ای" در میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 طیف مشخصی از اشعه ایکس از منطقه اندازه گیری و عناصر اصلی آن در طول مشاهده نمایش داده می شود.



نرم افزار SMILE VIEW میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200

تولید سریع گزارش توسط نرم افزار SMILE VIEW Lab میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 سبب مدیریت یکپارچه داده ها در میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 می شود. دکمه مدیریت نمایش داده تنها روی صفحه مدیریت اطلاعات نمایش داده می شود و به شما این امکان را می دهد که یک گزارش از تمام تصاویر و داده های آنالیز، و همچنین بررسی یا تجزیه و تحلیلی دوباره داده های از قبل کسب شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل JSM-IT200 انجام دهید .



* 1 برای گرفتن یک تصویر CCD، SNS اختیاری (سیستم در مرحله جهت یابی) مورد نیاز است.

* 2 نسخه قابل اجرا به LA (میزان خلاء کم و آنالیز).

3.0 nm (30 kV), 15.0 nm (1.0 kV)	SEM	رزولوشن حالت خلاء زیاد میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
4.0 nm (30 kV, BED)	SEM	حالت خلاء کم میکروسکوپ الکترون روبشی SEM
×5 to ×300,000 (Denied with a display size of 128 mm × 96 mm)	SEM	بزرگنمایی مستقیم میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
× 14 to ×839,724 (on the monitor) (Denied with a display size of 358 mm × 269 mm)	SEM	بزرگنمایی نمایش داده شده میکروسکوپ الکترونی SEM
W filament, Fully automatic gun alignment	SEM	بمباران الکترونی میکروسکوپ الکترونی SEM
0.5kV to 30 kV	SEM	شتاب ولتاژ میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
1 pA to 1 μA	SEM	جریان پروب میکروسکوپ الکترون روبشی SEM
10 to 100 Pa	SEM	تنظیمات فشار LV میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
-31 stage, with XY ine adjustment function	SEM	دهانه لنز شی ایی میکروسکوپ الکترونی SEM
filament adjustment, Gun alignment, Focus /Stigmator /Brightness /Contrast	SEM	عملکرد اتوماتیک میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
150 mm dia. × 48 mm height	SEM	حداکثر سایز نمونه میکروسکوپ الکترونی SEM
XY-2 axes motor-drive eucentric stage X: 80 mm, Y: 40 mm, Z: 5 to 48 mm Tilt: -10 to 90°, Rotation: 360°	SEM	محفظه نمونه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
Built-in	SEM	عملکرد مونتاژ میکروسکوپ الکترون روبشی SEM
127mm dia.	SEM	صفحه نمایش هماهنگی موقعیت اندازه گیری میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
Built-in (includes EDS condition*2)	SEM	دستورالعمل های استاندارد میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
Secondary electron image, REF image, Composition image*1, Topographic image*1, Stereo-microscopic image*1, etc.	SEM	حالت عکس میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
320 × 240, 640 × 480 1280 × 960 2560×, 1920 5120× 3,840	SEM	پیکسل تصویر میکروسکوپ الکترون روبشی SEM
Microsoft® Windows® 10 64bit	SEM	سیستم عامل میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
24-inch touch panel	SEM	مانیتور مشاهده میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
Refer to EDS speciications	SEM	عملکرد EDS میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
Built-in (distance between 2 points, distance between parallel lines, angle, diameter, etc.)		
"SMILE VIEW™ Lab"	SEM	مدیریت عملکرد داده ها میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
Output Microsoft word Output Microsoft power point	SEM	عملکرد تولید گزارش داده ها میکروسکوپ الکترون روبشی SEM
Operable on UI (Japanese/English)	SEM	تغییر زبان میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
Fully automatic, TMP: 1 RP: 1	SEM	سیستم خلا میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
Single-phase 100 V AC, 50/60 Hz, 1.5 K Va Voltage regulation Within ±10% Grounding terminal 100 Ω or less	SEM	میزان برق مصرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
15 ± 27°C	دمای اتاق	راه اندازی اتاق میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
60% or less	رطوبت اتاق	

2,000 mm (W) × 2,500 mm (D) × 1,800 mm (H) or more Door width 850 mm or more Door wide : 850 mm or more	ابعاد محظه ميکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
---	---